



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 39739

Kl. 42 b, 12/02

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Budowlanych *)

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

Warszawa, Polska

Aparat do ciągłego pomiaru grubości tafli szklanej

Patent trwa od dnia 17 grudnia 1955 r.

Przedmiotem wynalazku jest aparat do ciągłej kontroli sposobem optycznym grubości ciągniętej tafli szkła bez dotykania jej powierzchni.

Aparat i jego działanie uwidoczniono schematycznie na rysunku. Składa się on ze źródła światła jednorodnego Z, przesłony P, z naniesionymi rysami dla promienia głównego 1 i promieni pomocniczych 2 i 3, soczewki S oraz ekranu E (szkło matowe). W zależności od grubości g tafli T odbita wewnętrznie część 1' promienia głównego 1 przesuwają się między promieniami 2' i 3', określającymi jej dopuszczalne położenia graniczne.

Stosunek odległości 1 i 2 do 2 i 3 winien być równy stosunkowi grubości minimalnej do pola tolerancji. Nieuniknione w pracy przesunię-

cia równoległe oraz ewentualne skreślenia tafli względem aparatu nie wpływają na wskazania.

Rzutowanie na ekran promienia 1' nie jest konieczne.

Aparat według wynalazku ma szczególne zastosowanie przy ciągłym pomiarze grubości tafli szklanej, gdyż pozwala na pomiar grubości tafli czy szyby szklanej w czasie jej wyciągania i do natychmiastowej regulacji jej grubości w czasie tej czynności.

Zastrzeżenia patentowe

1. Aparat do ciągłego pomiaru grubości tafli szklanej, znamienny tym, że posiada źródło światła jednorodnego, przysłonę (P) z trzema szparami lub rysami wysyłającymi trzy równoległe promienie lub cienie (1, 2, 3) na szklaną tafkę (T), soczewkę rozpraszającą (S) chwytającą promienie odbite oraz ekran (E).

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest inż. Henryk Strzałkowski.

2. Aparat według zastrz. 1, znamienny tym, że na przysłonie (P) odległość szpar czy rys dla promieni czy cieni (1, 2, 3) jest tak dobrana, aby stosunek odległości między promieniem czy cieniem (1) a promieniem czy cieniem (2) do odległości między promieniem czy cieniem (2) a promieniem czy cieniem (3) równała się stosunkowi minimalnej założonej

grubości (g) tafli (T) do założonej dopuszczalnej tolerancji.

Biuro Projektów Przemysłu
Materiałów Budowlanych
Przedsiębiorstwo Państwowe
Wyodrębnione

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

